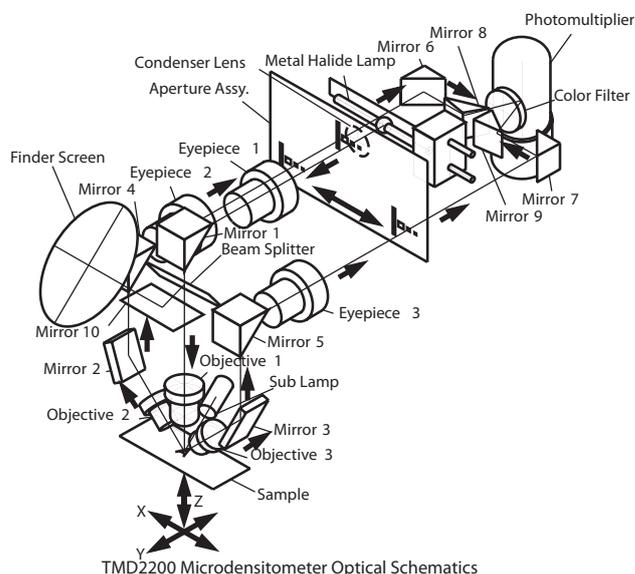


model TMD2200

高分解能反射マイクロデンシトメータ

SiE SAKATA INX ENG. CO., LTD.



装置概要

model TMD-2200は極めて分解能の高い画像測定能力を持つ反射専用のマイクロデンシトメータです。プリンタやコピー機の研究・開発・品質管理に最適な装置です。

特徴

- 光学系は照明/測光系の両側にアパーチャーを持つ暗視野光学系で、照明光自体を絞り込んでいるため8,000dpi以上の高分解能でのハイコントラスト測定が可能です。
- 0度照明、二方向の45度測光でオートフォーカス機能を持っているためサンプルの凹凸の影響を受けにくい測定が可能です。
- 測定条件の設定、ステージのX-Y駆動、ゼロ点調整はコンピュータ制御のため、測定が容易で、測定者によるばらつきが無く、データ処理も行きやすい制御系を備えています。
- 内部のLUT(Look Up Table)を使用し、適正なフィルタをセットすれば測定値を標準の値に合わせ込むことができます。

仕様

測定方式	照明、測光のダブルアパーチャー方式、二方向0/45光学系
フォーカシング	赤外レーザによるオートフォーカス
測定濃度範囲	0~2.5D
測定アパーチャー(μm)	3×3、5×5、10×10、5×50
ゼロ点調整	コンピュータ制御によるワンタッチ方式
濃度補正	LUT方式、ユーザ定義可能
カラー濃度測定	フィルタポケットにカラーフィルタ(Optional)を挿入することにより可能
出力	3桁デジタル表示、RS232C外部出力(コマンドによる)
オンライン機能	ステージ移動、測定距離、測定ピッチ、測定ライン数、ラインピッチ、原点復帰、データ転送
光源	メタルハライドランプ
光電圧変換器	フォトマルチプライヤ(アンチモンセシウムカソード、9段増倍型)
ステージ移動量	X方向:200mm、Y方向:100mm
ステージ送りスピード	1mm/sec(平均)
サンプリングピッチ	X、Y軸とも最小1μm
電源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	W320×D682×H511mm (突起部を除いた寸法)

※本カタログに記載されている内容は予告無く変更されることがあります。

日本総代理店

SiE サカタインクスエンジニアリング株式会社

本社 東京都板橋区新河岸2-3-13
〒175-0081 Tel.03-3930-2653 Fax.03-3930-2654
大阪事業所 兵庫県伊丹市北河原4-1-12
〒664-8507 Tel.072-785-7746 Fax.072-785-7729
ホームページ: <http://www.inx-eng.co.jp>